


事業者名	名古屋市								
機器名	X線回折装置								
写真									
特徴・用途	<p>試料表面にX線を照射して得られる散乱X線の回折現象を利用して、物質の原子・分子の配列状態を観察し、物質の構成成分を特定する。1) 固体、粉末、薄膜材料などの組成分析・同定、2) 薄膜の膜厚測定、3) 微小領域に局在した異物の特定、4) 液中に分散したナノサイズ粒子の大きさや形状・粒度分布測定、5) 試料の残留応力解析などの用途に利用可能。</p>								
設置場所	名古屋市工業研究所								
利用状況	年月	稼働日数 (日)	依頼試験・ 依頼分析 (件)	技術指導 (件)	試験設備貸出・利用		受託研究・ 共同研究 (件)	その他 (件)	利用件数 計(件)
					件数(件)	時間(時間)			
	平成27年12月	1	4	0	0	0	0	1	5
	平成28年1月	10	3	0	0	0	0	15	18
	平成28年2月	13	6	0	0	0	0	13	19
	平成28年3月	13	36	0	0	0	1	17	54
	平成28年4月	6	33	0	0	0	0	4	37
	平成28年5月	13	22	0	0	0	0	8	30
	平成28年6月	15	33	0	0	0	0	11	44
	平成28年7月	8	41	0	0	0	0	4	45
	平成28年8月	8	33	0	0	0	0	6	39
	平成28年9月	11	13	0	0	0	0	8	21
	平成28年10月	16	25	0	0	0	1	14	40
	平成28年11月	10	51	0	0	0	0	7	58
	平成28年12月	13	29	0	0	0	0	8	37
	平成29年1月	9	5	0	0	0	2	6	13
	平成29年2月	13	35	0	0	0	1	4	40
平成29年3月	8	2	0	0	0	1	3	6	
利用者等の声	<p>高性能なX線回折装置を導入したことで、利用者からは下記の利点があげられている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・粉末測定においては、1試料あたりの測定時間が短縮されたため、依頼試験の納期が従来より短くなった。</li> <li>・金属応力測定や透過法による測定、小角散乱測定等、新規の分析・測定が可能となった。</li> <li>・測定結果の解析を行うデータベースが更新されたことで、試料組成の同定ができる可能性が大きくなり、より有益な分析を行えるようになった。</li> </ul>								
補助事業概要 の広報資料	<a href="http://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/document/list/kikai/h27/pdf/27-046koho.pdf">http://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/document/list/kikai/h27/pdf/27-046koho.pdf</a>								